

LICENCE MENTION PHYSIQUE, CHIMIE

## PARCOURS CHIMIE

### Semestre 5

# Cristallographie : Symétrie et diffraction de rayons X

## Présentation

Responsable de l'UE : Smail TRIKI

**6 crédits ECTS**

Volume horaire

Travaux Dirigés : 27h

Cours Magistral : 28h

## Compétences visées

Acquérir les bases de la symétrie spatiale, de la cristallographie géométrique et de la diffraction des rayons X. Comprendre le rôle de la symétrie dans la caractérisation des réseaux cristallins et les relations structure/propriétés.

## Modalités de contrôle des connaissances

### Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
UE	CT	Ecrit - devoir surveillé	180	3/4	
	CC	Autre nature	30	1/4	Note = max (CT, 3/4 CT + 1/4 CC)

### Session 2 : Contrôle de connaissances

Nature de l'enseignement	Modalité	Nature	Durée (min.)	Coefficient	Remarques
UE	CT	Ecrit - devoir surveillé	120		